

日本原子力研究開発機構・量子科学技術研究開発機構施設利用共同研究成果報告リスト

区分	課題番号	研究代表者		利用施設
		氏名	所属機関	
一般共同研究	22050	高倉健一郎	熊本高等専門学校	QST

【1-1】学術論文：査読あり

No.	著者名	タイトル	誌名	巻(号)	掲載ページ	出版年
1						

【1-2】学術論文：査読なし

No.	著者名	タイトル	誌名	巻(号)	掲載ページ	出版年
1						

【2-1】学位論文：博士論文

No.	学位取得者名	タイトル	学位授与機関	学位授与年度
1				

【2-2】学位論文：修士論文

No.	学位取得者名	タイトル	学位授与機関	学位授与年度
1				

【2-3】学位論文：学士（卒業）論文

No.	学位取得者名	タイトル	学位授与機関	学位授与年度
1	松本 健佑	射線環境下における半導体素子の耐性評価	熊本高等専門学校	2022

【3】解説・記事

No.	著者名	タイトル	誌名	巻(号)	出版年
1					

【4-1】国際会議

No.	著者名	タイトル	会議の名称	開催場所	開催年
1	E. Simoen, K. Takakura et. al.	The impact of defects on the performance of semiconductor devices and materials	ECS Spring meeting	USA	2022

【4-2】国内会議

No.	著者名	タイトル	会議の名称	開催場所	開催年
1	吉田 一真	射線環境下における半導体素子の耐性評価	令和3年度 国際原子力人材育成イニシアティブ事業フォーラム	オンライン	2022

【5】講演

No.	発表者名	タイトル	会の名称	主催者	開催場所	講演年月日
1						

【6】プレスリリース

No.	発表機関名	タイトル	媒体	発表年月日
1				

【7】受賞

No.	受賞者名	賞の名称	授与機関	受賞年
1				

【8】特許

No.	出願人	発明者	発明の名称	出願方法	出願番号	出願年月日
1						

【9】書籍

No.	著者名	タイトル	出版社名	出版年
1				